PAT-NO: JP363045547A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63045547 A

TITLE: DETECTING METHOD BY MICROWAVE FOR CONDUCTIVE

FOREIGN

MATTER PRESENT IN DIELECTRIC PENETRATING

THROUGH

RESONATOR

PUBN-DATE: February 26, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHINOHARA, KIBATSU YOSHIGAMI, HIDEO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY NIPPON KOSHUHA KK N/A

APPL-NO: JP61190086

APPL-DATE: August 13, 1986

INT-CL (IPC): G01N022/02, G01V003/12, H01P007/06

US-CL-CURRENT: 324/636

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve foreign matter detection sensitivity by passing a sample

along the electric field of a resonator and increasing an in-use frequency.

CONSTITUTION: Holes 2 < SB > 1 < /SB > and 2 < SB > 2 < /SB > are bored in the barrel wall

of a cylindrical cavity resonator and the sample is passed through them. A

microwave sweep signal is applied from an input terminal 4 and the resonance

mode is so set that the sample is along the electric field. The resonance

output is led out from an output terminal 5 and variation in its resonance

frequency and resonance amplitude are monitored on the screen of an oscilloscope or monitored continuously without any operator by using a simple

computer circuit. When a dielectric is moved along the electric field of the

resonance electromagnetic field of the resonator 1, etc., a normal sample and a

sample containing foreign matter has an electromagnetic difference, so the

difference is detected as variation in resonance frequency and reflected wave

electric power, or insertion loss or impedance to recognize the presence of the foreign matter.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-45547

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)2月26日

G 01 N G 01 V 22/02 3/12 H 01 P 7/06 B - 8406 - 2GA - 6738 - 2G 6749 - 5 J

審査請求 有

発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称

共振器内を通過する誘電体の内部に存在する導電性異物のマイクロ 波による検出方法

> 创特 頤 昭61-190086

> > 勧

願 昭61(1986)8月13日 22出

⑫発 明 者 篠 己 抜 神奈川県横浜市緑区小山町607-5

明 ⑫発 者

秀 Ŀ

神奈川県相模原市相武台団地2206-42

人 ①出 願

男 日本高周波株式会社

神奈川県横浜市緑区中山町1119番地

30代 理

弁理士 福 田

原

1. 発明の名称

共振器内を通過する誘電体の内部に存在する 導電性異物のマイクロ波による検出方法

2. 特許請求の範囲

(1)連続波または周波数掃引を行ったマイクロ 波信号を、共振器または同様の器内に導き、その 電界方向に誘電体を移行させて、入射波と通過波 もしくは反射波から検出する共振問波数、イン ピーダンス、挿入損失または通過電力もしくは反 射電力の相対的変化から、誘電体内に存在する導 世性異物を検出するマイクロ波異物検出方法。

3. 発明の詳細な説明

イ、発明の目的

〔産業上の利用分野〕

最近 電子機器の使用周波数がますます上昇し、 游体間隔がミクロン程度を下題る勢いとなり、誘 電体内の数細な金属片の存在が事故の基となる場 合が多くなって来た。従って、微小な導電性異物 を高感度に検出できる方法が必要となっている。

本苑明は、誘電体繊維または幅の狭い誘電体布 や講ת体板内に含まれる異物を、高感度に検出す ることを目的とする。

〔従来の技術〕

同種の目的に対し、公開特許公報昭59-214748 **号および何昭 80-87844号の発明が公開されている** が、これらはガラス繊維またはその製品に高電圧 を印加し、異物による放電現象を検出するもので ある。またマイクロ被を使用するものに公開特許 公報昭 80-20138号があるが、入射波と通過波もし くは反射波との間の信号位相差の変化を検出する 方法である。

従って前者の従来方法では高電圧・大電力を使 用するために、安全性に問題を生じ、装置も大形 となる欠点がある。また後者はマイクロ被信号間 の位相差を検出するために、検出感度が低く誤差 が大となる。特に微小異物を対象として、使用問 波数を高める程、この欠点が著しくなる。

本発明は上記諸問題を解消した誘電体内の微小

異物の検出方法を提供することを目的とする。 ロ、発明の構成

〔問題点を解決するための手段〕

本発明は、建統波または周波数場引を行ったマイクロ被信号を、共振器または帯域建波器体を開加し、その発生電界に沿う如く被測定誘電体を通過させ、正常な場合と異物を含有する場合との利対的電磁気的変化により、異物の存在を検出することを特徴とするマイクロ波による誘電体内の異物検出方法である。

なお、上記の電磁気的変化とは、入射被信号と 通過被信号または反射被信号から検出される共振 周波数、インピーダンス、挿入损失、反射被電力 または通過電力の変化等である。

(作用)

共級器等の共振電磁界の電界に沿って誘電体を移動させると、正常な試料と異物を含む試料とでは電磁気的変化を生じるから、その差を、共振周波数や反射被電力、または挿入损失もしくはインピーダンスの変化として検出し、異物の含有を認

視することも容易である。

第2図の例で35 GHzの帯域建被器に無反射終端器を接続した。この建被器の中央に、直径5~7ミクロンのガラス繊維を通し、これの中心に直径2.5ミクロン長さ3mm程度の金属片を挿入した所、反射量が正常時より24~30dB増加し、容易に異物混入を識別できた。また使用周被数を70 GHzに選ぶことによって、直径2.5ミクロン長さ2mm程度の異物混入識別が容易であった。

知できる。またその検出感度を向上させ遊説的な 無人監視を可能とするためには適宜なコンピュー タ処理も有効となる。

また試料の結合部としては帯域建被器を含む各種共振器を使用でき、試料の誘電率、金属性異物の大きさ等によって、使用周被数帯や、共振時のQを適宜選択でき、高分解能の検出が可能となる。

信号発生額としては、単一周被数でもよいが、 帰引周波数額を使用すれば、共振周波数やその共 級根幅の変化として検出が容易になる。

(実施例)

第1 図は円筒形空桐共級器1を使用する例で、その胴態に孔21・22を穿ち、これに試料3 の胴態に孔21・22を穿ち、これに対外3 印記され、共振姿態は、試料が電界に沿うようの取り付けされる。共振出力は、出力端で変化は、りの共振周被数や共振振幅の変化は、がはない、その共振周波数や共振振幅の変化は、が単して、コープ面上で監視することもできる的に無人なコンピュータ回路を使用して、連続的に無人

ハ、発明の効果

本発明は上述のように、共振器の電界に沿って
試料を通過させるもので、使用周波数を高めることによって、異物検出感度を向上させることができ、簡単に無人連続監視が可能となる特徴を有する。

4. 図面の簡単な説明

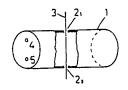
第1 図は本発明の円筒形空洞共振器を使用した 一例、第2 図は導被管形帯域建被器を使用した本 発明の一例を示す。

1 は円筒形空間共振器、21・22 は試料師入孔、3 は試料、4 はマイクロ披信号入力端、5 はマイクロ披信号入力端、5 はマイクロ披信号出力端、6 は導波管形帯域遮波器、7 は無反射終端器。



第 1 図

. . . .



第 2 図

